XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451 2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)| ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

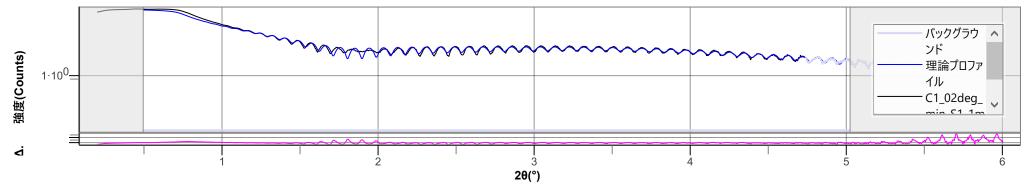
フィッティング手法: 準ニュートン データ間隔:1点ごとにフィッティング

最大反復数: 500 許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号	•	材料		膜厚(nm)		密度(g/cn	n³) <d></d>	粗さ(nm) <rgh></rgh>	
✓	L5	F ₀ 2O3	Fe2O3		Const		4.94999	Const	0.100	Con
	LJ	16203			精密化	±0.06	\rightarrow	·最大 精密化	±0.03最 小 ←	精密化
\checkmark	L4	F02O2	Fe2O3		Const		2.65822	Const	0.100	Con
	L 4	. • , re203			精密化	±0.02	最小←	精密化	±0.03最 小 ←	精密化
	L3	· Fo	* * o Fe		Const		7.87400	Const	0.000	Con
\checkmark	LS	. », re			精密化	±0.05	\rightarrow	最大 精密化	±0.03最 小 ←	精密化
	L2	· Fo	* Fe		Const		7.25335	Const	0.100	Con
	LZ	re			精密化	±0.03	\rightarrow	最大 精密化	±0.04最小←	精密化
\checkmark	1.1	* * Fo	Fe		Const		3.93700	Const	0.100	Con
	L1	. • , re			精密化	±0.11	最小←	精密化	±0.04最小←	精密化
	基板	🖸 Si			_∞		2.32924	Const	0.500	Con